

ФОТОПОТЕМНЕНИЕ И ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ ФАРАДЕЯ В ПЛЕНКАХ СТЕКЛООБРАЗНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКОВ

B.K. Тихомиров, М.М. Червинский

В халькогенидных стеклообразных полупроводниках (ХСП) наблюдаются эффекты фотоиндуцированных анизотропии и гиротропии (линейных и круговых дихроизма и двулучепреломления) [1]. В работе [2] были исследованы особенности этих эффектов в пленках ХСП различного химического состава при межзонном возбуждении. В частности, в [2] было показано, что для пленок ХСП характерно вращение плоскости поляризации света, которое может быть обусловлено как линейным дихроизмом, так и круговым двулучепреломлением. Величина этого вращения изменялась в процессе облучения пленок линейно-поляризованным светом, что было связано с возникновением фотоиндуцированных линейного дихроизма и кругового двулучепреломления.

Известно, что пленки ХСП некоторых химических составов, особенно хорошо стеклообразующих систем As-S, As-Se обладают эффектом фотопотемнения (см. последний обзор на эту тему [3]), проявляющимся в длинноволновом свдиге края поглощения в результате облучения этих пленок излучением, вызывающим межзональные переходы.

Целью настоящей работы было исследование эффекта Фарадея в пленках ХСП и его сопоставление с известными ранее фотоиндуцированными хэффефектами в этих материалах, а также выяснение возможностей использования этих пленок для обработки оптической информации с использованием магнитного поля. Впервые показано, что явление фотопотемнения в пленках ХСП сопровождается фотоиндуцированным изменением величины эффекта Фарадея (константы Верде), т.е. фотоиндуцированным эффектом Фарадея.

Исследовались пленки толщиной 1–5 мкм следующих химических составов: Se, Sb₂S₃, Ge₂₈Pb₁₅S₃, As₂S₃ и As_xS_{1-x}, приготовленные методом термического испарения либо высокочастотного ионно-плазменного распыления на одинаковые подложки из силикатного стекла. Измерения эффекта Фарадея проводились компенсационно-автоматизированным методом в геометрии нормального эффекта, как описано в [4]. При этом величина магнитного поля сканировалась между значениями –300 и +300 Э с помощью адаптивного источника тока. Перед измерением установка прогревалась в течение 0.5 ч. Собственный дрейф исходного сигнала не превышал 0.5 угл.сек. в течение 4 мин развертки поля.

На рис. 1 представлена зависимость вращения плоскости поляризации γ линейно-поляризованного плоскоапараллельного пучка света He-Ne лазера ($\lambda = 633$ нм) от магнитного поля H в пленке Se (точнее, суммарного вращения в пленке Se и подложке). Линия между точками 1 и 1' соответствует первому "циклу" развертки поля от $-H_0$ до $+H_0$ ($H_0 = 300$ Э), который длился 4 мин. Линия между точками 1' и 2 соответствует второму "циклу" развертки поля от $+H_0$ до $-H_0$. Этот цикл, как и все последующие ($2 \rightarrow 2'$, $2' \rightarrow 3$ и т.д.), также длился 4 мин.

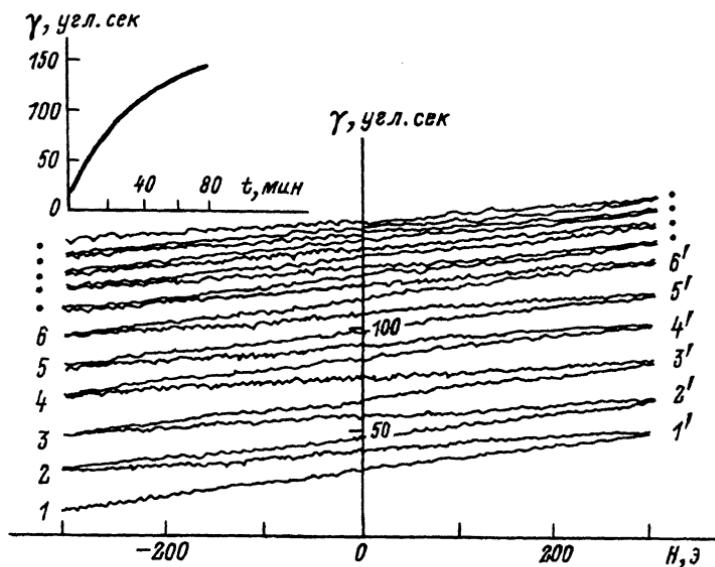


Рис. 1. Зависимость $\gamma(H)$ в пленке Se с подложкой.

$1 \rightarrow 1'$, $1' \rightarrow 2$ и т.д. — последовательность циклов развертки магнитного поля H . Толщина пленки 2.5 мкм, толщина подложки 2 мм, интенсивность света 30 мВт/см². На вставке — кинетика изменения вращения плоскости поляризации при $H = 0$.

Отметим характерные особенности рис. 1. Уже при $H = 0$ значение $\gamma \neq 0$. Линия $1 \rightarrow 1'$, $2 \rightarrow 2'$ и т.д. не совпадают друг с другом. Линии $1 \rightarrow 1'$, $2 \rightarrow 2'$ и т.д., соответствующие развертке поля от $-H_0$ до $+H_0$, почти параллельны друг другу, как и линии $1' \rightarrow 2$, $2' \rightarrow 3$ и т.д., соответствующие развертке от $+H_0$ до $-H_0$.

На рис. 2 представлена зависимость γ от H для пленки AsSe. Кроме особенностей, свойственных рис. 1, на этом рисунке есть еще одна деталь — резкая асимметрия изменения γ в процессе облучения при $-H_0$ и $+H_0$, т.е. линии $1 \rightarrow 1'$, $2 \rightarrow 2'$ и т.д., соответствующие развертке от $-H_0$ до $+H_0$, не параллельны друг другу, как и линии $1' \rightarrow 2$, $2' \rightarrow 3$ и т.д., соответствующие развертке от $+H_0$ до $-H_0$. На вставке к рис. 2 представлена зависимость γ от H для чистых подложек, из которой видно прекрасное совпадение прямых, полученных при сканировании поля от $-H_0$ до $+H_0$ и обратно.

Известно, что в веществах, не обладающих спонтанной намагниченностью, фарадеевское вращение определяется формулой:

$$\gamma = RhH, \quad (1)$$

где R — константа Верде, h — толщина образца. Таким образом, при сканировании поля от $-H_0$ до $+H_0$ и обратно прямые $\gamma(H)$ должны строго совпадать. Отклонение от этого закона на рис. 1, очевидно, объясняется тем, что в процессе облучения пленок Se в них происходит фотоиндукционное изменение оптической активности (что согласуется с данными [2]). На вставке к рис. 1 показана кинетика изменения вращения плоскости поляризации, полученная из данных рис. 1 при $H = 0$. Значения γ при $H \neq 0$ соответствуют суммарному вкладу от фарадеевского вращения и фотоиндукционной оптической активности.

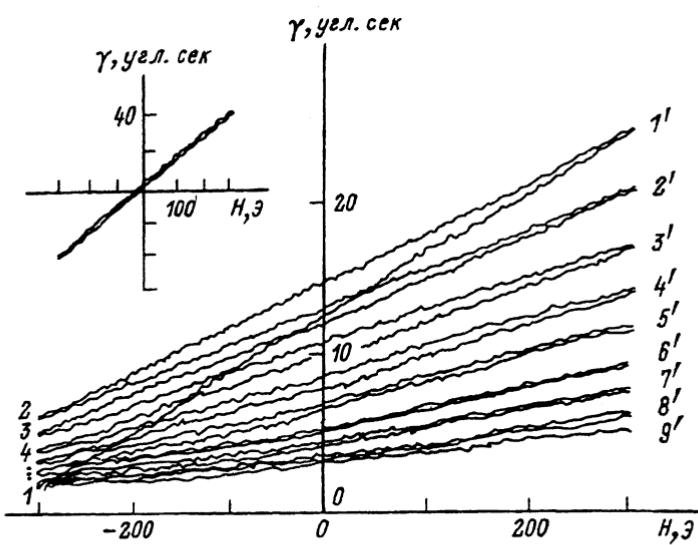


Рис. 2. Зависимость $\gamma(H)$ в пленке AsSe с подложкой.

$1 \rightarrow 1'$, $1' \rightarrow 2$ и т.д. — последовательность циклов развертки магнитного поля H . Толщина пленки 2.5 мкм, толщина подложки 2 мм, интенсивность света 30 мВт/см². На вставке — зависимость $\gamma(H)$ для чистых подложек.

В пленках AsSe в дополнение к фотойндукционной оптической активности имеет место изменение наклона прямых, соответствующих развертке поля в одном направлении, т.е. в них имеет место фотойндукционное изменение “константы” Верде, которая в данном случае не является константой. Для прямой $1 \rightarrow 1'$ на рис. 2 $R = -2.8$ мин/Э·см. (Вычисление проведено с учетом вращения в подложке, для которой $R = -0.017$ мин/Э·см. Отметим, что знак вращения в подложке положителен, а в пленке — отрицателен). Для прямой $9 \rightarrow 9'$ $R = -5.4$ мин/Э·см. Значения R для пленок получены с погрешностью, определяемой конечным временем развертки поля, в процессе изменения которого несколько изменяются и константа Верде, и оптическая активность.

Для диамагнитных материалов, к числу которых относят и стеклообразные полупроводники [5], справедливо соотношение Беккераля

$$R = \frac{e\omega}{mc^2} \frac{dn}{c\omega}, \quad (2)$$

где e , m — заряд и эффективная масса электрона; ω — частота света; n — показатель преломления.

Из (2) видно, что изменяется в процессе облучения могут $dn/d\omega$ или m . В пленках AsSe под действием света происходят фотоструктурные превращения [1,3], проявляющиеся, в частности, в эффектах фотопотемнения и фоторефракции, поэтому более логично предположить фотойндукционное изменение дисперсии показателя преломления в формуле (2). Не вдаваясь в детальный анализ дисперсии показателя преломления (который прекрасно сделан в применении к стеклообразным полупроводникам в работах [6,7]), заметим, что его фотойндукционное изменение, вероятнее всего, обусловлено фотойндукционным смещением собственной частоты осциллятора ω_0 оптического перехода, соответствующего эффекту

Фарадея, относительно частоты Не–Не лазера ω . Отметим также возможность фотойндцированного парамагнитного фарадеевского вращения (всегда имеющего отрицательный знак), которое может проявляться в результате фотойндцированного возникновения оборванных химических связей (парамагнитных центров) в пленках ХСП, имеющего место при фотоструктурных превращениях [7,8].

Таким образом, явления фотопотемнения и фотойндцированного фарадеевского вращения взаимосвязаны, что подтверждается также следующими дополнительными результатами.

1. Константа Верде не изменяется в процессе облучения пленок AsSe, приготовленных методом высокочастотного ионно-плазменного распыления, в которых фотопотемнение отсутствует.

2. R остается неизменной в процессе облучения пленок Sb_2S_3 и $Ge_{28}Pb_{15}S_{57}$, в которых фотопотемнение отсутствует.

3. R неизменна при длительном облучении (Не–Не лазером) пленок As_2S_3 , обладающих фотопотемнением при возбуждении значительно более коротковолновым излучением и практически прозрачных для Не–Не лазера.

4. Фотопотемнение и фотойндцированное изменение R достигают насыщения одновременно.

В заключение авторы выражают благодарность В.М.Любину за участие в работе на ее начальном этапе.

Список литературы

- [1] Lyubin V.M., Tikhomirov B.K. // J. Non-Cryst. Solids. 1989. V. 114. P. 133–135; 1991. V. 13. P. 37–48.
- [2] Lyubin V.M., Tikhomirov V.K., Chervinskii M.M. // Semicond. Sci. Technol. 1991. V. 6. P. 807–809.
- [3] Pfeiffer G., Paesler M.A., Agarmal S.C. // J. Non-Cryst. Solids. 1991. V. 130. P. 111–143.
- [4] Червинский М.М., Глаголев С.Ф., Горбунов И.П. Магнитооптические методы и устройства для измерения магнитных характеристик материалов. Л., 1980. 242 с.
- [5] Anderson P.W. // Phys. Rev. Lett. 1975. V. 34. P. 952–955.
- [6] Keybus P., Grevendunk W. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. P. 8540–8545.
- [7] Vanhuysse B., Grevendunk W., Addrienssens G.J., Dauwen J. // Phys. Rev. B. 1987. V. 35. P. 9298–9300.
- [8] Лихолит И.Л., Любин В.М., Мастеров В.Н., Федоров В.А. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 1. С. 172–178.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе РАН
Санкт-Петербург

Поступило в Редакцию
11 сентября 1992 г.
В окончательной редакции
14 декабря 1992 г.